

Development of Non Destructive Damage Evaluation Technique for Austenitic Stainless Steel

Yuji NAGAE Kazumi AOTO Zhenmao CHEN

Advanced Technology Division, O arai Engineering Center

高速増殖炉プラントの長寿命化を実現する技術開発の一環として,損傷に対する非接触非破壊検出法の開発を 行っている。供用中材料のき裂発生前からの損傷を非破壊的に検出することが可能となれば,高速増殖炉プラン トの健全性維持や信頼性を飛躍的に向上させることができる。

本報告では,高速増殖炉プラント機器の代表的材料であるオーステナイト系ステンレス鋼を対象として,室温 での引張損傷及び疲労損傷による磁気特性変化,及び高速炉プラントにおいて重要であるクリープ損傷による磁 気特性変化について報告する。いずれの損傷負荷においても,損傷の初期から磁気特性が変化することが分かっ た。このことは,磁気特性変化によりき裂発生以前の損傷を非接触非破壊で捉えることが可能であることを示し ている。

A non destructive evaluation method is being developed in series of research for the realization of the longer life nuclear power plants. The detection of damage before cracking and initiation by a non destructive test could enhance the reliability of nuclear power plants. However, the developed non destructive techniques focus on the detection of damage after crack initiation. The developments of an innovative technique is strongly required to detect damages before crack initiation.

In this study, the change in natural magnetization was investigated as tensile damage, fatigue damage and creep damaged progress in the paramagnetic material, in order to develop the reliable, non contact type and non destructive testing method for the structural components and piping systems. As results, it was found that the magnetic field changes as damage progresses, obviously from the early stage of damage level.

#### キーワード

SUS304,非磁性,オーステナイト相,漏えい磁束密度,非破壊検出技術,引張,疲労,クリープ,き裂発生,損傷

SUS304, Non magnetic, Austenitic Phase, Leakage Flux Density, Non destructive Technique, Tensile, Fatigue, Creep, Crack Initiation, Damage



\* 現在:本社 社内公募型研究推進室 Presently, Innovative Research Promotion Office, Head Office

\*1現在:(株)普遍学国際研究所 Presently, International Institute of Universality

研究報告

## 1.はじめに

高速増殖炉プラントの長寿命化を実現する技術 開発の一環として,非接触非破壊検出法の開発を 行っている。供用中材料のき裂発生前からの損傷 を非破壊的に検出することが可能となれば,高速 増殖炉プラントの健全性維持や信頼性を飛躍的に 向上させることができる。

これまでに開発されている非破壊検出手法に は,超音波,放射線,渦電流などを用いたものが ある<sup>1</sup>。米国NASAによる非破壊検出技術の基本分 類を表1に示す<sup>2)-3</sup>。これらの方法を用いることに より,プラントの健全性を評価することが可能と なっている。しかし,これらはいずれもき裂発生 後の損傷,つまりき裂を非破壊的に検出する方法 である。プラントの信頼性・安全性を向上させる 上では,き裂発生以前からの損傷を検出する必要 があると考える。これまでのところ,き裂発生以 前の損傷を検出する技術は確立されていない。し たがって,き裂発生以前からの損傷を検出できる ような非破壊検出技術法の開発が必要となる。

ここでは,高温構造材料として使用されている SUS304鋼に着目する。この材料は,高速増殖原型

分類	試験方法
機 械 的 - 光学的技法	<ul> <li>・目視 - 光学的方法</li> <li>・ホログラフ式干渉法</li> <li>・光弾性皮膜法</li> <li>・応力塗料</li> <li>・ストレーンゲージ</li> <li>・微小硬度</li> <li>・液体浸透法</li> <li>・「揮発液法</li> <li>・フィルター粒子法</li> <li>・ホログラフ式干渉法</li> </ul>
透過放射線 技 法	<ul> <li>・X線透過試験法</li> <li>・ 線ラジオグラフィ</li> <li>・中性子ラジオグラフィ</li> <li>・透過放射線測定法</li> <li>・後方散乱放射線法</li> <li>・オートラジオグラフィ</li> <li>・放射化ガス浸透法</li> <li>・陽電子消滅法</li> </ul>
電磁気的 - 電気的技法	<ul> <li>・静磁場法</li> <li>・磁粉探傷法</li> <li>・核磁気共鳴法</li> <li>・パルクハウゼン効果</li> <li>・渦流法</li> <li>・電気抵抗法</li> <li>・帯電粉末法</li> <li>・コロナ放電法</li> <li>・自然電子放射</li> <li>・マイクロウェーブ放射</li> </ul>
熱 的 技 法	・接触測温 ・熱起電力法 ・赤外線放射測定 ・液晶法 ・エレクトロサーマル法
音響 - 超音 波 技 法	<ul> <li>・音響衝撃法</li> <li>・音響振動法</li> <li>・アコースティクエミッション法</li> <li>・渦流音響振動法</li> <li>・超音波パルス反射法</li> <li>・超音波過透法</li> <li>・超音波振法</li> <li>・超音波臨界角法</li> </ul>
化学 - 分析 技 法	<ul> <li>・化学スポットテスト</li> <li>・電解プローブ法</li> <li>・レーザープローブ法</li> <li>・イオンスキャッター法</li> <li>・イオンプローブ法</li> <li>・オージェ分析法</li> <li>・蛍光X線法</li> <li>・中性子放射化法</li> <li>・荷電粒子放射化法</li> </ul>

表1 NASA による非破壊検出技術の基本分類

炉「もんじゅ」の主要構成材料である。本鋼はオー ステナイト相を有しており,非磁性である。しか し,室温やそれよりも低い温度での引張損傷や疲 労損傷により,磁性相であるマルテンサイト相が 生成するとの報告がある<sup>()-6)</sup>。あるいは,負荷によ り磁気モーメントが同方向に揃い,磁性を生じる 可能性がある。このような変化を,外部から非破 壊的に磁気特性変化として検出することにより損 傷を把握できる可能性がある。これらの現象の模 式図を図1に示す。このような磁性の発生はき裂 発生以前から観察され,磁性発生による材料の磁 気特性変化を非破壊的に検出することにより,き 裂発生以前の損傷状況を把握できる可能性がある と考える。

本報告では,最初に室温での引張損傷及び疲労 損傷による磁気特性変化について報告する。また, 引張損傷を受けた時の金属組織観察結果について 報告する。

しかし,室温での損傷による磁気特性変化に関 する研究のみでは高速炉構造材料に適用可能性に ついて判断することはできない。それは,高速炉 プラントは500 前後の高温で運転されるため,変 形(ひずみ)が時間経過とともに進行し,破損に 至るクリープが問題となるからである。しかし, き裂発生以前のクリープ損傷を磁気特性変化に基 づいて捉えようとする試みは,これまで行われて いない。そこで次に,SUS304鋼において,クリー プ損傷進行による磁気特性変化,並びに磁気特性 変化と金属組織との関連について検討した結果に ついて報告する。

2.試験方法

## 2.1 損傷負荷試験

損傷負荷試験片は,圧延方向が応力軸と同じに なるように採取し,磁気特性変化測定が可能なよ



図1 非磁性材料における損傷による磁性変化

#### うに平板形状とした。

引張試験及び疲労試験を室温で行った。引張試 験は,ひずみ速度0.01%/sで,ひずみ9%まで行 われた。引張損傷の進行による磁気特性変化を検 討するために,(1)ひずみ3%,(2)6%及び (3)9%で試験を中断させた。疲労試験は,中央 部に長さ3mmの切り欠きを有する試験片を用い て行った。疲労試験は,ひずみ範囲±0.25%,ひ ずみ速度0.1%/sで行われた。

また,クリープ試験を,大気中,温度923K,応 力118 MPaで行った。損傷進行による磁気特性変 化を調査するために,クリープ中断試験を行った。 本試験条件でのクリープ曲線を図2に示す。ク リープ試験の中断は,(1)負荷直後,(2)二次ク リープ開始時点(100時間),(3)三次クリープ開 始時点(740時間),(4)三次クリープ域(1269時 間)で行った。また,同温度での熱時効試験を行 い,クリープ損傷材との比較を行った。

## 22 漏えい磁束密度分布測定

磁気特性変化は,試験片からの漏えい磁束密度 を測定することにより評価した。

漏えい磁束密度を測定するセンサには,ホール磁 気センサ,フラックスゲート磁気センサ(Flux Gate Sensor FGセンサ)超伝導量子干渉磁気 センサ(Superconducting Quantum Interference Device,SQUID)<sup>7)</sup>などがある。ホール磁気センサ は地磁気〔05ガウス(Gs)程度〕の測定までが 限度であり,それ以下の微弱な磁気変化を検出す ることは困難である。また,SQUIDは冷媒を入れ るデュワーが必要であり,試験片を冷却させない

70 SUS304 60 923K, 118MPa 50 三次クリープ開始 40 いずみ/ 30 次クリープ開始 20 定常クリープ速度 10 0 500 1000 1500 時間/hr

図2 クリープ曲線

ようにするため試験片とセンサの距離を離す必要 がある。試験片を冷却させることにより,金属組 織が変化する可能性がある。つまり,SQUIDを用 いると損傷とは関係のない現象を捉える可能性が ある。そこで,漏えい磁束密度の測定には,薄膜 タイプのFGセンサ<sup>®)</sup>を用いた。本FGセンサは, 地磁気以下の微弱な磁気変化を検出することがで き,冷媒を必要としない。また,FGセンサの分解 能は0.001ガウスである。ただし,使用温度は60 までである。したがって,クリープ試験を行いな がら,その場で漏えい磁束密度測定を行うことは, 現在のところ不可能である。

いずれの損傷負荷試験においても,試験を中断 し,または破損させた後,試験機から試験片を取 り出し,試験片の二次元漏えい磁束密度分布を測 定した。二次元漏えい磁束密度測定装置の外観写 真を写真1に示す。FGセンサを試験片上で走査さ せて二次元漏えい磁束密度を測定した。

また,室温で行う引張試験及び疲労試験では, 試験中にその場で漏えい磁束密度の測定を行っ



✔ FGセンサー部の拡大



写真1 二次元漏えい磁束密度測定装置

その場測定及び中断後の測定でのFGセンサー と試験片との間隔(リフトオフ距離)はいずれも 05mmとした。

# 2.3 金属組織観察

**Fixing Instrumen** 

引張試験において,磁気特性変化と関連する金 属組織観察として,局所すべり帯及びマルテンサ イト相に着目した。局所すべり帯の観察には走査 型電子顕微鏡を用い,またマルテンサイト相の観 察には透過型電子顕微鏡を用いた。金属組織観察 は,磁気特性変化の大きい領域と,ほとんどない 領域で行った。

クリープ損傷において,磁気特性変化と関係す る金属組織因子として,まずCr量に着目すること とした。Cr量に着目した理由については43章で 述べることにする。

Cr量は走査型電子顕微鏡 - エネルギー分散型 X線分光法 (SEM EDS)を用いて測定した。Cr

train Sens



図3 その場漏えい磁束密度測定

量の測定はクリープ破断試験片に対してのみ行っ た。破断面からの距離がクリープ損傷過程の経時 変化と対応していると考え、(1)破面、(2)破面か ら85mm離れた領域で組成分析を行った。破面は 損傷が最も厳しい領域であり、破面から85mm離 れた領域は破面に比べれば損傷を受けていない領 域であると考えられる。破面または結晶粒界に沿 って長さ500μm内において1~2μmピッチで組 成分析を行った。組成分析はスポット分析を行い、 各スポットでのCr濃度を定量的に求めた。

## 3.漏えい磁束密度分布測定結果

3.1 引張損傷

まず,3%引張損傷負荷を行った場合の,引張 損傷負荷試験中におけるその場での漏えい磁束密 度測定の結果を図4に示す。この測定結果から, 引張損傷の進行により磁性を生じることが分か る。特に,変形初期の弾性領域で漏えい磁束密度 が急激に増加していることが分かる。その後の塑 性領域は弾性領域と比較して,緩やかに漏えい磁 束密度が増加することが分かる。

次に,ひずみ(1)3%,(2)6%及び(3)9% で中断させた時の二次元漏えい磁束密度分布を図 5(a)~(c)にそれぞれ示す。非常に大きな漏 えい磁束が試験片平行部端に観察されている。そ の他の領域での漏えい磁束密度は低く,一様な分 布となっている。負荷を除いた後でも,引張損傷 による漏えい磁束密度を生じていることが分か る。ひずみ6%及び9%というように,ひずみを 増加させても,二次元漏えい磁束密度分布は3% でのそれと大きな変化がない。この傾向は,その



(ひずみ3%まで)





図5 引張試験を行った時の二次元漏えい磁束密度分布

場での漏えい磁束密度測定での結果と同様であ る。

このように,引張損傷においては損傷の初期から磁気特性が変化することが分かった。

### 3.2 疲労損傷

疲労損傷による漏えい磁束密度変化を検討する ために,その場漏えい磁束密度測定を行った。任 意のサイクル数での漏えい磁束密度のヒステレシ ス曲線を図6に示す。サイクル数の増加とともに, ヒステレシス曲線の面積及び振幅が増加している ことが分かる。サイクル数の増加によるヒステレ シス曲線の面積及び振幅の変化を図7及び8にそ れぞれ示す。ヒステレシス曲線の面積は,疲労損 傷初期で急激に増加していることが分かる。10000 サイクルを超えると,ヒステレシス曲線の面積の 増加は緩やかになる。一方,ヒステレシス曲線の 振幅は,面積の変化とは異なり,疲労損傷初期に 急激な増加は見られず,サイクル数の増加ととも に単調に増加している。

これらの結果より,ヒステレシス曲線の面積は 疲労損傷のモニタリングに適用することができる と考えられる。つまり,ヒステレシス曲線の面積 の変化が緩やかになってきたら,それは疲労寿命 の限界になってきていることを意味している。

さらに,疲労き裂を磁気特性変化により検知可 能か判断するために,破損まで試験を継続させた。 疲労破損後,表面に2mmのき裂が観察された。 そのき裂を漏えい磁束密度の測定により検知でき るかどうか検討するために,破損後の二次元漏え い磁束密度を測定した。その結果を図9に示す。 図中矢印で示した部分にき裂が観察されている が,その部分でわずかではあるが漏えい磁束密度 の変動が見られる。つまり,漏えい磁束密度によ りき裂を検知可能であることが分かる。

以上のように,疲労損傷においても引張損傷と 同様に,損傷の初期から磁気特性が変化すること が分かった。また,磁気特性変化によりき裂を検 知することができることが分かった。

## 33 クリープ損傷

本章では,受け入れ材,クリープ中断材及び熱 時効材の二次元漏えい磁束密度分布の結果につい て示す。二次元漏えい磁束密度分布の測定の前に, 試験片の磁化を増加させ試験片からの漏えい磁束 密度を増加させるために試験片に着磁を施した。

まず,受け入れ材の測定結果を図10に示す。受け入れ時には,漏えい磁束密度に大きな変動のない一様な分布となっている。漏えい磁束密度の絶対値は0.05ガウスである。SUS304鋼の場合,受け入れ時点で磁性を示す相が存在する。受け入れ時における相の量は,0.1~0.2%である。しかし,受け入れ材の漏えい磁束密度測定結果から, この程度の相の量であれば,着磁を施しても微小な漏えい磁束密度でしかないことが分かる。

次に,クリープ損傷を受けた時の漏えい磁束密 度分布として,二次クリープ開始時点で中断させ



Number of cycles

50000

60000

70000

40000

図7 疲労サイクル数に伴うヒステレシス曲線の面積変化

た試験片の測定結果を図11に示す。また,比較として100時間(二次クリープ開始時間相当)の熱時 効材の測定結果を図12に示す。二次クリープ開始 時点では,試験片中央部に漏えい磁束密度変化の 激しい領域が見られる。その領域での漏えい磁束 密度の絶対値は035ガウスである。この値は,受 け入れ時の7倍の漏えい磁束密度である。一方, 二次クリープ開始時点と比較して 熱時効材では,

10000

20000

30000

-0.002 L

漏えい磁束密度の大きな変動は見られない。しか し,受け入れ材の漏えい磁束密度分布と比較する と,漏えい磁束密度が増加しており,漏えい磁束 密度にも変動があることが分かる。また,熱時効 材の漏えい磁束密度の最大絶対値は,0.15ガウス である。この値は,二次クリープ開始時のそれと 比較して小さい値となっている。

三次クリープ開始時点での漏えい磁束密度分布



においても,二次クリープ開始時点でのそれと同様に,漏えい磁束密度の大きな変動が見られた。 これらの結果から,クリープ損傷を受けることにより,クリープ損傷の初期段階から磁気特性が変 化することが分かった。

#### 4.考察

研究報告

4.1 引張損傷における磁気特性変化と金属組織変化

3.1で示したように 引張損傷により漏えい磁束 密度が変化し,その分布は一様でないことが分か った。そこで,漏えい磁束密度発生原因を検討す るために,漏えい磁束密度が測定された領域とそ うでない領域において金属組織観察を行った〔図 5(c)参照〕。

まず,走査型電子顕微鏡による金属組織観察結 果を写真2に示す。局所すべり帯が多くの結晶粒 内に観察される。漏えい磁束密度に及ぼす局所す べり帯の影響を検討するために,局所すべり帯が 観察される結晶粒数を求めることとした。その結 果を表2に示す。低い漏えい磁束密度領域と比較 して,高い漏えい磁束密度が測定されている領域 では,局所すべり帯を有する結晶粒の数は約2倍 となっている。

このような局所すべりに誘起されて磁性相(例 えば,マルテンサイト変態)が析出し,局所すべ リ帯が多く発生している場所で高い漏えい磁束密 度を示す可能性がある。そこで,透過型電子顕微 鏡を用い,局所すべり帯にマルテンサイト相が析 出しているかどうか検討することとした。高い漏 えい磁束密度を示した領域のおける,透過型電子 顕微鏡による金属組織観察の結果を写真3に示 す。局所すべり帯が黒い線として観察されている。 その局所すべり帯が黒い線として観察されている。 その局所すべり帯の中にマルテンサイト相が観察 された。したがって,局所すべり帯が多く存在す ると,マルテンサイト相も多く観察されると考え られる。このようなマルテンサイト相により,引 張損傷において漏えい磁束密度が観察されると考 えられる。

4 2 磁気特性変化によるクリープ破断位置の推定 3 3で示したように、クリープ損傷進行による漏 えい磁束密度変化を測定したところ、クリープ損 傷を受けることにより漏えい磁束密度が変化する ことが分かった。さらに漏えい磁束密度の変化に よりクリープ損傷を検出可能かどうか判断するた



Bottom side



40 µ m

## 写真2 引張試験片の金属組織観察結果(ひずみ9%)

## 表2 局所すべり帯が観察された結晶粒の数

領域	位置	局所すべり帯を有する結晶粒の数
Bottom Side	edge site	32
	central site	71
Top Side	edge site	16
	central site	36

めには,漏えい磁束密度変化によりクリープ破断 位置を推定することが可能かどうか検討する必要 がある。そこで,三次クリープ域中で中断させた 試験片(通算試験時間:1269時間)の漏えい磁束 密度を測定し,その後クリープ破断までクリープ 試験を行い,クリープ破断位置を特定した。そし て,漏えい磁束密度変化とクリープ破断位置との 比較を行った。

まず,三次クリープ域中で中断させた試験片の 二次元漏えい磁束密度分布を図13に示す。なお,



写真3 透過型電子顕微鏡による引張試験片の 金属組織観察結果

この結果は着磁を施していない場合の結果であ る。この結果から,図中丸印で囲んである領域に おける漏えい磁束密度が急激に変化していること が分かる。

図2のクリープ曲線からも分かるように,三次 クリープ域では急激なひずみの増加があり,三次 クリープ域中での中断時の標点間距離と比較し て,クリープ破断時のそれはさらに長くなる。従 って,三次クリープ域での漏えい磁束密度分布上 のどの位置で破断したかを推測する必要がある。

そこでまず,三次クリープ域中断後のクリープ 破断試験を行う前に,三次クリープ域中断試験片 の外観観察を行うこととした。外観観察の結果を 写真4に示す。この観察結果から,三次クリープ 域中断時に,左側のツバ部から9~10mm(標点 間の中心から13~14mm)の領域を中心にくびれ を生じていることが分かった。したがって、この 中断時点で巨視的に均一変形とはなっておらず、 クリープ破断までくびれ付近を中心に両側に変形 をしていくものと予想される。つまり、くびれ付 近がクリープ破断位置となることが推測される。 図13に示した漏えい磁束密度分布は,写真4に示 した試験片において標点間の中央をX軸の原点と し左側を負の値としている。したがって,図13に おいて - 13~ - 14mm がくびれ (necking)の位置 と考えられる。この位置は,漏えい磁束密度が急 激に変化している領域とほぼ同じ位置にあること が分かる。

次に,クリープ破断位置を特定するために,ク リープ破断後の外観観察を行った。その結果を写



図13 三次クリープ域内(1269時間)で中断させた 試験片の二次元漏えい磁束密度分布



写真4 三次クリープ域内(1269時間)で中断 させた試験片の外観観察結果



写真5 クリープ破断後の外観観察結果

真5に示す。外観観察の結果,クリープ破断位置 は図において左側のツバ部から約12mmの位置で あった。三次クリープ域中断での標点間距離は 46mm,クリープ破断後のそれは53mmであった。 したがって,三次クリープ域中での中断から, 7mmほど伸びてクリープ破断したことになる。 くびれを中心に両側に伸びて破断したとすれば, 研究報告

位置である12mmとほぼ一致する。つまり、くび れ位置でクリープ破断したと考えられる。

これらの結果は,漏えい磁束密度変化からク リープ破断位置を推定することができることを示 している。

## 43 磁気特性とCr量との関連性の検討

磁気特性変化と関連する金属組織因子として, ここではCr量に着目している。まず,Cr濃度に 着目した理由を示す。

材料が磁性を持つためには,まず磁気モーメントが存在し,更にその磁気モーメントが同方向に 向く必要がある。これにより,自発磁化を生ずる ことになる。

SUS304鋼の主成分は, Fe, Cr及びNiである。 この中でCrの磁気モーメントは非常に小さく(ほ とんど零),一方FeやNiは大きな磁気モーメント を持つ<sup>9)</sup>。また、磁気モーメントの方向性は原子間 距離に依存している<sup>10)</sup>。つまり,磁気モーメント を有しても,原子間距離により自発磁化を示した り示さなかったりする。理論的に考えて,臨界原 子間距離を超えると自発磁化を示すようになる。 通常,オーステナイト相の原子間距離は臨界値よ りも小さいために自発磁化を示さない。これらを 基に,次に示すようにSUS304鋼における磁性発生 について推論することができる。

SUS304鋼は高温に晒されると炭化物や 相が 析出することがよく知られている<sup>11)</sup>。しかし,炭 化物及び 相は非磁性である<sup>12),13)</sup>。つまり,これ らの析出物による磁性の発生はないと考えられる。

しかし, Crが炭化物や 相などに供給され,母 相中のCrが欠乏することが考えられる。これによ リ,母相中の空孔濃度が増加し,原子間距離が広 がる可能性が考えられる。また, Crが欠乏した領 域での局所的な変形による原子間距離の広がりも 考えられる。これらCr欠乏により原子間距離が広 がる可能性があり,これにより自発磁化を生じる 可能性が考えられる。また, Cr欠乏により磁性を 有するマルテンサイト相やフェライト相が析出す ることも考えられる。このような推論により,磁 気特性変化と関連する金属組織因子としてCr濃度に着目することとした。

次に,クリープ破断材のCr濃度の測定結果につ いて示す。破面近傍及び破面から8 5mm離れた領 域において,各スポットのCr濃度を度数分布でま とめた結果を,それぞれ図14(a)及び図14(b) に示す。破面から8 5mm離れた領域では,Cr濃 度17 5wt%以上(通常のCr濃度は18~19wt%であ るので,測定誤差などを考慮して,17 5wt%以下 をCr欠乏と考えた)を示すスポット数が,全測定 スポット数の99%を占めている。一方,破面近傍 では,Cr濃度17 5wt%以上を示すスポット数が全



測定スポット数の87%であり、それ以下のCr濃度 を示すスポット数が全体の13%も占めている。ク リープ破断位置から離れた損傷の小さいと考えら れる領域と比較して、Cr濃度17 5wt%以下の領域 がかなり多くなっていることが分かる。

4 2で示しているように、破面近傍では漏えい磁 束密度が急激に変化している領域である。従って, Cr 欠乏と磁気特性変化は関連している可能性が あることが分かった。また,破面近傍のような損 傷の厳しい領域では,破面から離れた領域と比べ Cr 欠乏領域が広いことが分かった。

# 5.おわりに

き裂発生以前からの損傷を非破壊的に検知可能 な手法を開発する目的で,高温構造材料として広 く用いられている非磁性材料であるSUS304鋼を 対象に,引張,疲労及びクリープ損傷による磁気特 性変化を調査した。その結果,以下の知見を得た。

引張,疲労及びクリープ損傷の進行により磁 気特性が変化する。いずれの損傷においても, その磁気特性の変化は損傷の初期から観察され る。これは,磁気特性変化がき裂発生以前から の損傷を検知できる可能性があることを示して いる。

引張及びクリープ損傷材にて二次元漏えい磁 束密度分布は一様ではなく,漏えい磁束密度を 示す領域は限られていることが分かった。その 原因について検討するために,磁気特性が大き く変化している領域で金属組織観察を行った結 果,引張ではマルテンサイト相を,クリープで はCr欠乏を生じていた。これらの金属組織変化 が磁気特性変化と関連しているものと考えられ る。

疲労試験あるいはクリープ試験では,磁気特 性変化と疲労き裂発生位置あるいはクリープ破 損位置との比較を行った。その結果,磁気特性 が急激に変化している領域で疲労き裂,あるい はクリープ破損を生じていた。この結果は,磁 気特性変化により疲労き裂発生位置あるいはク リープ破損位置をき裂が生じる前の早い段階で 推定することができることを示している。

クリープ損傷のみならず,クリープ疲労損傷 による磁気特性変化について検討を行い,実用 への適用性を検討する。また,磁気特性変化と 金属組織変化との関連についても検討を行う。

#### 参考文献

- 1)例えば,(社)日本非破壊検査協会:"非破壊検査技術の保守検査への適用例 検査と材料評価 」49 (2000).
- ファインセラミックスの非破壊検査システムに関する研究調査報告書"(財)機械システム振興協会, (1987).
- 3)日本非破壊検査協会編:"新非破壊検査便覧",日刊 工業新聞社(1992).
- 4 ) M.Bayerlein, H.J.Christ et al." Plasticity induced martensitic transformation during cyclic deformation of AISI 304L stainless steel ",Mater.Sci.Eng., A114, L11 (1989).
- 5 ) K.Aoto, Z.Chen, et al." Detection of damage in type304 SS based on natural magnetization ",Proceedings of Relationship between Magnetic and Structural Properties, 125 (2000).
- 6)日本AEM学会:"電磁破壊力学を応用した劣化・損 傷の非破壊評価技術に関する調査研究分科会報告 書", JSAEM R 9803 (1999).
- 7) 茅根一夫,中山哲,他:"超伝導磁気センサー (SQUID)を用いた非破壊検出装置",検査技術,2, (1997)59.
- 8)務中達也,吉見健一,他:"薄膜フラックスゲート磁 気センサーの試作",島津評論,53,75(1996).
- 9) 岩波書店:"岩波理化学辞典(第5版)", 291·Slater Pauling曲線(1998).
- 10)(社)日本金属学会編:"講座・現代の金属学 材料編
   1 材料の構造と物性", 185(1994).
- 11) 例えば,田中秀雄,村田正治,他:鉄と鋼,74,2009 (1988).
- 12) ステンレス協会:"ステンレス鋼便覧", 104(1995).
- 13) 長谷部慎一,浅山泰: "ステンレス鋼溶接金属の熱・ 負荷履歴によるミクロ組織変化"材料 46,7(1997).